

適用規格							
定格	使用温度範囲	-45℃～ + 125℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ + 60℃ (注2)			
	電圧	AC 50 V	適合コネクタ	△ DF12#(3.0)-*DS-0.5V(**)			
	電流	0.3 A					
性能							
	項目	試験方法	規格			QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。				○	○
電気的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	50 mΩ以下			○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上			○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	極数	挿入力 (N)以下	抜去力 (N)以上	○	—
			10	19.8	1.5		
			14	21.3	2.1		
			20	23.4	2.6		
			30	27.0	3.4		
			32	27.6	3.6		
			36	29.0	4.0		
			40	30.6	4.2		
			50	34.2	5.0		
			60	38.0	6.0		
80	45.0	7.4					
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐振性	周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	温度サイクル	温度 -65 → 15~35 → 125 → 15~35℃ 時間 30 → 10~15 → 30 → 10~15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150~180℃ 90~120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田 (リペア) の場合 】 半田ごてで 350℃、3秒の条件にて半田付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。			○	—
	二酸化硫黄	濃度10ppm, 96時間放置する。 (試験規格 : JEIDA-39)	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			○	—
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			○	—
備考							
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。							
(注2) 保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は、使用温度範囲が適用 されます。エンボス梱包仕様時の保存温度範囲には-10~+50℃となります。							
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5 4 0 2 を適用している。							
	△の数	訂正記事	設計	検図		年月日	
△	1	DIS-H-001982	YH. MICHIDA	TS. MIYAZAKI		07. 04. 20	
				承認	MO. NAKAMURA	05. 09. 20	
				検図	TS. MIYAZAKI	05. 09. 20	
				担当	YH. MICHIDA	05. 09. 20	
				製図	HK. MURAKAMI	05. 09. 20	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC4-160780-06			
HRS	製品規格表		製品名	DF12B(3.0)-*DP-0.5V(86)			
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	GL537	△	1/1	